

2014 International Reliability Physics Symposium 報告会のお知らせ

下記の日程にて、2014 IRPS 報告会を開催致します。
皆様にご参加を頂きたくご案内申し上げます。

主催: IEEE EDS Japan Chapter

EDS ホームページ: <http://www.ieee-jp.org/japancouncil/chapter/ED-15/>

【日時】平成 26 年 10 月 3 日(金) 13:00-18:05

【会場】芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交流棟 4 階 402 教室

http://www.shibaura-it.ac.jp/about/campus_toyosu.html

【参加申し込み】

資料準備の都合上、事前に参加申し込みをお願いしております。

参加者の御氏名、御所属、御連絡先、学生/社会人、EDS 会員かどうか

を記して、産総研昌原 (m.masahara@aist.go.jp) まで E-mail にてお申込みをお願い致します。

(締め切り: 9 月 29 日までをお願いいたします。)

【参加費】

IEEE EDS 会員 及び 学生 : 無料

一般 : 2,000 円

プログラム

1. 13:00-13:05 「はじめに」
PETRA 最上 徹 (EDS Japan Chapter Chair)
芝浦工大 上野和良 (実行委員長)
2. 13:05-13:20 IRPS Management 委員報告
京都大学 江利口浩二
3. 13:20-13:45 「IRPS 2014 概要報告」
(株)東芝 首藤 晋
4. 13:45-14:10 「IRPS 2014 プロセスインテグレーション・ゲート絶縁膜総括」
(株)日立製作所 三木浩史
5. 14:10-14:35 「IRPS 2014 配線信頼性総括」
富士通セミコンダクター(株) 松山英也
6. 14:35-15:00 「IRPS 2014 Failure Analysis Session 総括」
ルネサスエレクトロニクス(株) 工藤修一
7. 15:00-15:25 「IRPS 2014 メモリ信頼性セッション総括」
(株)東芝 藤井章輔
- 15:25-15:40 休憩
8. 15:40-16:05 「IRPS2014 ソフトエラーセッション総括」
富士通セミコンダクター(株) 上村大樹
9. 16:05-16:25 「三次元集積化工程における Cu 汚染が薄化 DRAM チップの Retention 特性に
及ぼす影響」
東北大学 李康旭、福島誉史、田中 徹、小柳光正
10. 16:25-16:45 「最高 1000 万コマ/秒の超高速動画撮像による酸化膜破壊現象の動的観測と解析」
東北大学 黒田理人、邵 繁、木本大幾、古川貴一、須郷秀武、竹田 徹、宮内 健、
栃木靖久、寺本章伸、須川成利

11. 16:45-17:05 「ランダムテレグラフノイズにおけるマルチトラップ間の相関に関する研究」
東北大学 小原俊樹、寺本章伸、米澤彰浩、黒田理人、須川成利、大見忠弘
12. 17:05-17:25 「SiC-MOSFET 閾値電圧シフトのモデリング」
(株)東芝 菊地拓雄、ETH Zurich Integrated Systems Laboratory, Mauro Ciappa
13. 17:25-17:45 「Cu/Low-k ダマシ構造における配線層間 TDDB 故障メカニズムの検討」
ルネサスエレクトロニクス(株) 鈴村 直仁、小笠原 誠、古橋 隆寿、小山 徹
14. 17:45-18:05 「応力原子輸送モデルを用いた突き出し配線におけるストレス誘起ボイドの
寿命予測」
職業能力開発総合大学校 横川慎二